

お客様各位

セミコン・ジャパン 2009 出展のご案内

拝啓、時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、また弊社製品をご愛顧いただき厚くお礼申し上げます。

さて、弊社は、12月2日～4日、幕張メッセにて開催される「セミコン・ジャパン 2009」に出展いたします。この度のセミコンでは、環境保全に関わり新たな発展段階を迎えつつあるパワー半導体などの注目デバイスに対応した測定ソリューションを中心に展示いたします。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひご来場賜り、私共の最新ソリューションをご体感いただきたくご案内申し上げます。

社員一同、心よりお待ちしております。

敬具

ケースレーインストルメンツ株式会社

代表取締役社長
嶋崎文雄



セミコン・ジャパン 2009

日時：12月2日（水）～4日（金）、10：00～17：00

会場：幕張メッセ（国際展示場、国際会議場）

（詳細は同封の主催者「来場者用案内パンフレット」をご覧ください。）

ケースレー展示：

ブース： **ホール 8、8B-501**

（展示内容については、同封の展示概要フライヤをご覧ください。）

【お問い合わせ先】

ケースレーインストルメンツ株式会社 マーケティング部 菊地裕光

TEL：03-5733-7555 FAX：03-5733-7556 Eメール：info.jp@keithley.com

ベンチトップ用からシステム用途まで、 広がるACSファミリ

パラメトリック試験システム S530型

new

微小電流から高電圧まで、用途に応じて柔軟に構成できる、ACSプラットフォーム上で実現した完全自動のパラメトリックテスタです。

<デモ>

全ピンで 1000V までの試験を安全に行える高電圧システムを紹介します。多品種デバイス対応に不可欠なテストプラン開発の機能や、測定データの解析機能などを示します。

- 200V/1A 基本システム、1fA 低電流システム、1000V 高電圧システム
- 最大 8 チャンネル、60 ピン（低電流システム）
- CV 測定オプション：1kHz ~ 10MHz



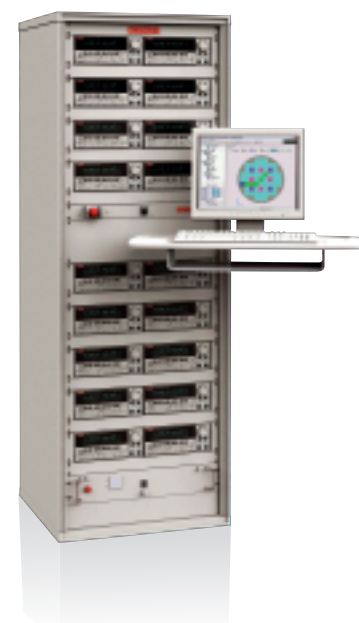
WLR信頼性試験システム S500型

信頼性 TEG を高速かつ大量に測定し、データ解析を簡素化した使い勝手のよいシステムです。

<デモ>

豊富な WLR 測定機能を紹介し、また、測定データのマネジメントフローなどにより測定評価が効率化することを示します。

- SMU パーピンによる同時並列測定
- ライブラリ：BTI、HCI、TDDDB、EM、QBD、・・・
- 強力なデータ解析機能



ACS-RFシステム

new

オンウェーハでRFデバイスの特性測定を行い、結果を各種形式で表示するシステムです。

<デモ>

ACS 環境下で、40GHz ベクトルネットワークアナライザを制御します。また、測定結果を専用の Viewer で表示し解析します。

- オンウェーハでの S パラメータ測定
- High-k ゲート解析、RF C-V 評価
- Viewer による多角的な測定データ解析

パワー半導体やエコ関連デバイスの 測定ソリューション群

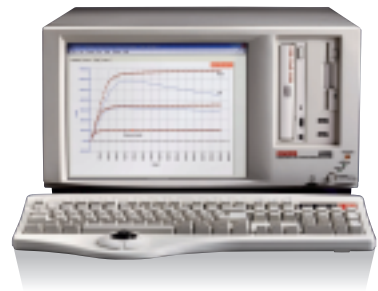
5000V ブレークダウン測定ソリューション

5000Vまでのブレークダウン電圧測定を、
4200-SCS型の操作環境で行うソリューションです。

<デモ>

人的な安全対策や測定器保護を施し、ブレークダウン特性を4200-SCSの表示
パネル上に描き出します。

- パワー MOS FET/ IGBT
- SiC、GaN などの化合物パワー半導体
- 車載用パワーデバイス



4200-SCS 型 半導体特性評価システム

40A 大電流 I-V 測定ソリューション

ケースレー 2602A ソースメータを 2 台用いて
最大 40A までの I-V 試験を行うソリューションです。

<デモ>

パワーデバイスの 40A の大電流までの静特性などを正確に測定します。
テストフィクスチャでの考慮点も含めて説明します。

- 太陽電池モジュール・パネル
- 高輝度LED
- パワー MOS FET



(イメージ図)

電源 IC の特性測定ソリューション

比較的パワーの小さい電源 IC の評価試験を行うソリューションです。

<デモ>

DC-DC コンバータと LDO の評価試験を低消費電力領域まで
1 台の SMU 測定器で行えることを示します。

- スイッチング DC-DC コンバータ
- LDO、チャージポンプ
- 充電 IC を含むパワーマネジメント IC



(イメージ図)